

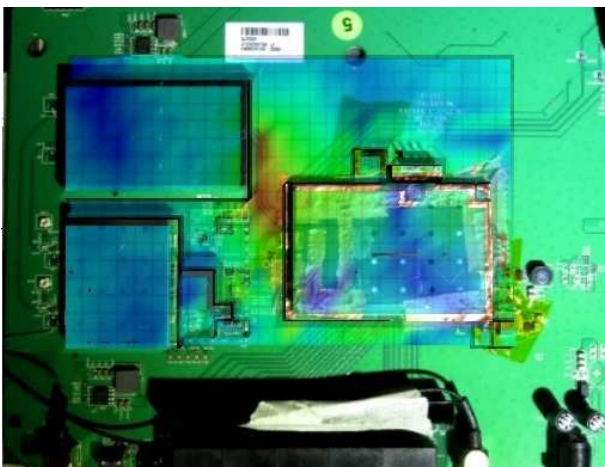
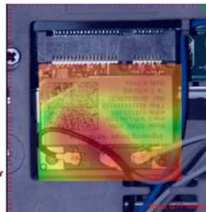
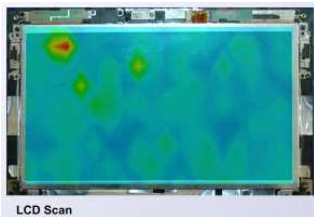
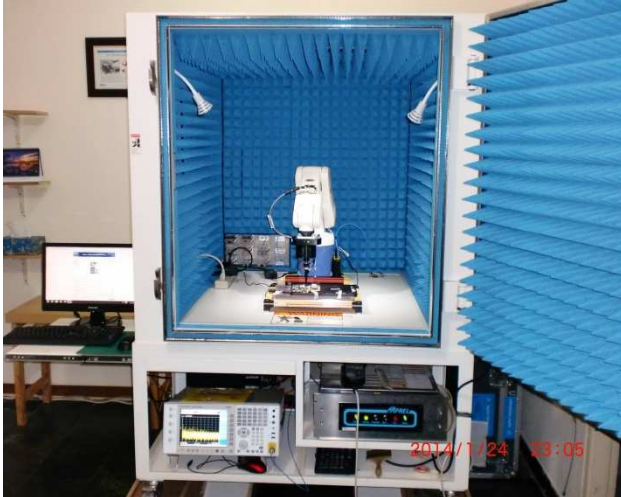
EM- ISight- 6GHz / 20GHz / 40GHz / UG67GHz /110GHz 電磁波EMI 自動掃瞄系統

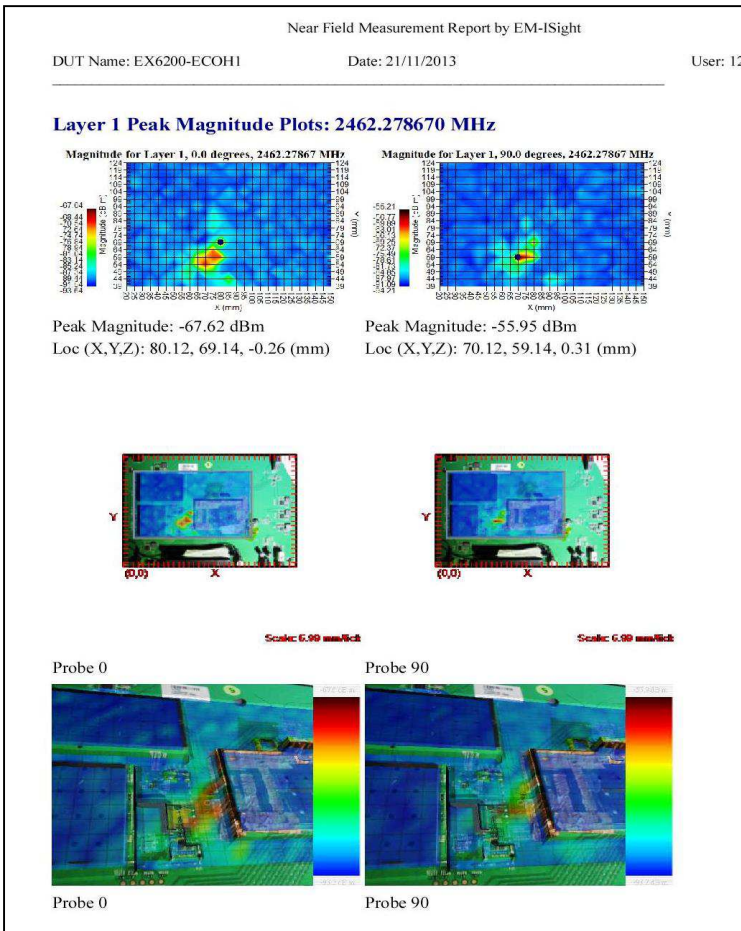
APREL EM-ISight 電磁波自動掃瞄儀是提供給工程師與相關應用工程人員之近場量測技術之強項產品,用於:

- a. 產品設計階段快速有效且準確的找出 EMI雜訊源.
- b. 快速確認,分析,研究,與雜訊對策改善,快速取得認證與縮短產品量產與上市時間.
- c. 高頻無線應用: 10k to 6/20/40GHz, 50 to 67/110GHz
 EM-ISight-1 10K-6GHz Single Probe Solution
 EM-ISight-2 10K-20GHz Single Probe Solution
 EM-ISight-4 10K-40GHz Single Probe Solution
 EM-ISight-mm 50G-67/110GHz Upgrade Model
- d. Maximum Permissible Exposure-MPE 量測 .
- e. Beam Forming Analysis 波束方向驗證 .

各項功能裁要:

1. 此系統根據國際法規 JIS T060-1-1-2 / IEC 60601-1-1-2. IEC61967, VCCI 指令對電路板的電磁場分析與掃瞄, 提供標準及準確之標準測試程序.
2. 若因為被測物的操作需要與條件更改,系統可以擴展延伸測試範圍至 10 KHz~ 6 / 20 / 40 / 67 / 110 GHz. 對於電路板的電磁場控制與掃瞄之標準測試程序所設計外, 做PCB電路板/ IC集成電路 的磁場做分佈掃瞄 .
3. 很容易掃瞄出帶有LCD顯示屏之動態磁場分佈..
4. 使用者可以輕易方便的設定被測物的掃瞄範圍. (X. Y. Z 的坐標位置)_ Robot control.
5. 可以容易設定掃瞄解析度(系統最高解析度0.02mm)
6. 3D 立體掃瞄, 可自動偵測零件高度掃瞄.
7. 可外拍EUT 相片輸入, 增加報告之 Over-layer 解析度. 配合特殊影像處理與疊加技術, 數據輸出更直觀, 更快速, 更加有技術參考應用價值.
8. 配合客製化小型電波隔離箱可隨處移動及安裝使用不受環境限制. 可取代大型電波暗室之測試功能.
9. 針對無線通訊產品, 可協助改善新產品的電路設計, 或是改善集成電路功能及雜訊洩漏控制, 改善RF電路板端雜訊或是優化天線設計與匹配電路改善..等.
10. 自動報告輸出, 有多種報告格式供使用者分析使用:
 - a. 2D Frequency / 2D Magnitude / 3D Magnitude .
 - b. 2D Frequency Layer with PCB over-layer.
 - c. 2D magnitude with PCB over-Layer.
 - d. 2D magnitude with PCB over-Layer & flux plot.
 - e. ISO17025 standard report _ Word file export . (附有自動場強篩選)
 - f. AVI format output_ 2D. 3D. 2D over layer,
 - g. 4D output format : Frequency, magnitude . Flux.
11. Delta plot report .(測試差異性報告)
12. EMI Far Field Approximation (EMI遠場拋射預估值)
13. Ambient Filtering function (環境雜訊去除功能)
14. Keysight . Anritsu. R&S, Tektronix spectrum Analyzer are compatible.
15. 可配合專用移動式隔離暗箱, 一站式測試方案, 節省空間與方便任何測試使用.



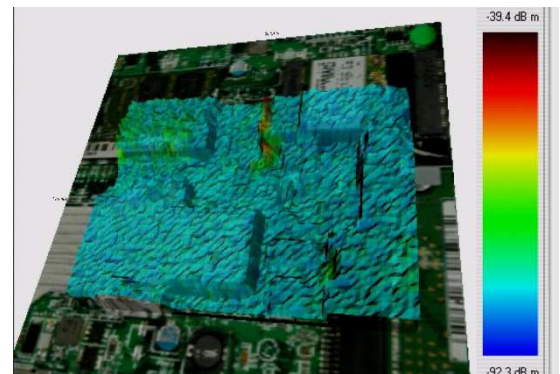


A. 利用二維掃描場強模式制作雜訊分佈圖，可以精確指出雜訊發散分佈圖及高精度位址。提高工程人員對主板上主振源與的雜訊源等頻率分析效率。進一步快速解決雜訊發散所引發之工程問題。(Radiation source)

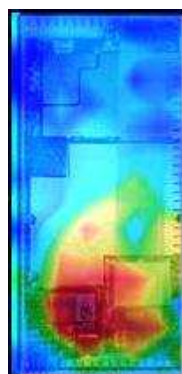
B. 使用頻譜分析儀可以容易的顯示出電磁波強度梯形圖，透過資料輸出到微軟WORD檔案資料處理，可以清楚獲得2D.3D.及實際場強與零件面相對位置。(2D/4D OVERLAYER)

C. 利用動態電磁場變化與3/4D分佈圖，並透過使用者介面工具，可以明確指出電磁場發散強度高點的位址。

D. 使用者可以為電路板或集成電路制做四維場型圖 (4D + Flux)，將磁力線方向明顯測試後標示出4D + FLUX 的分析圖，方便於工程分析及研究。



GPS Noise Measurement with High sensitivity (Better than -135dbm)



訂購 EM-ISight 與技術洽詢等服務，請訪問我們網頁或與我全球服務網點連絡：

APREL Lab. Web: : www.aprel.com ; www.sglplus.com

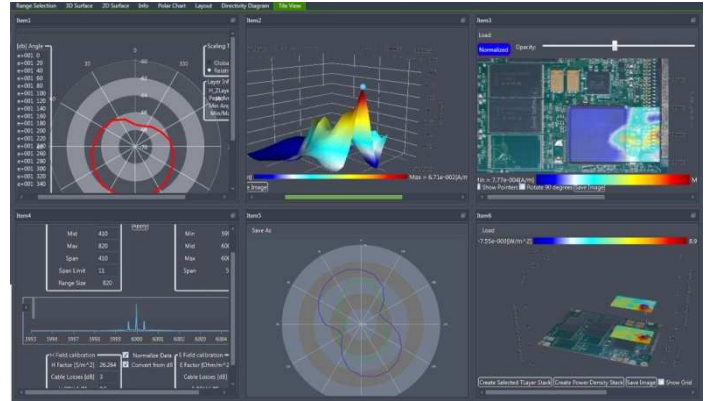
中華區代理商: **SmartNet Global Limited** (TEL: +886-2-26013807 MP: +886-935335713)

APREL亞洲技術支持中心(Taipei) : MP: +886- 935335713

RF-ISight 進階近場掃描分析系統

RF-ISight Analytical Tool Box for EM-ISight

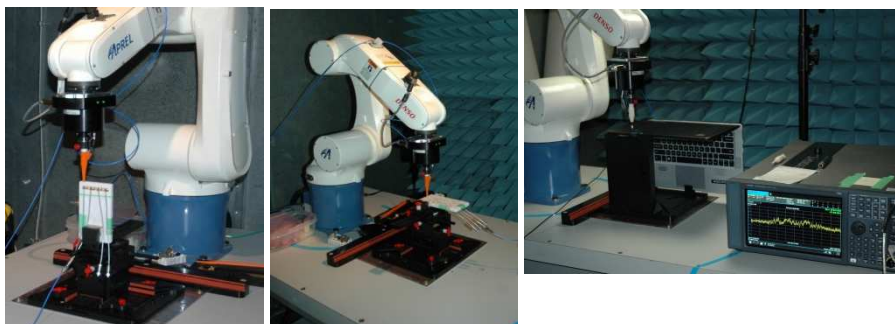
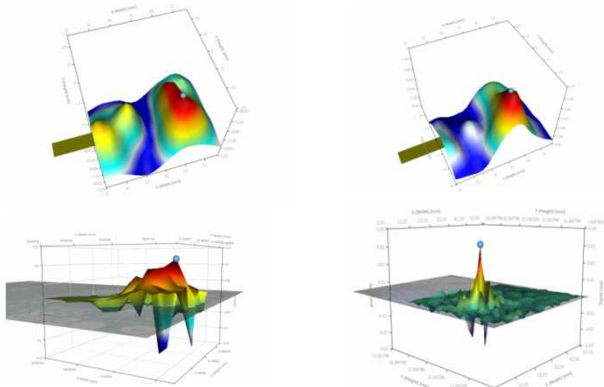
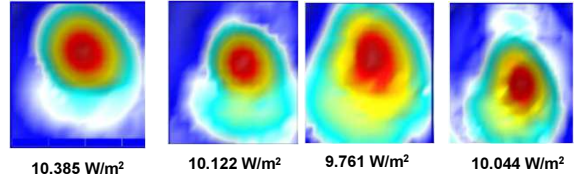
RF-ISight Application Concept



Functionality 主要功能說明

- 5G MPE Assessment
 - Power density 功率密度
 - Emitted power 輻射功率
 - E and H field peak cross-detection 電場與磁場向量分析
 - Poynting vector 坡印廷向量分析
- 5G Antenna design
 - Directivity/gain 天線方向與增益
 - Efficiency 天線效率
 - E/H phase shift 電場與磁場相位偏移
 - Beam forming/orientation 波束賦形
 - Reverse energy 反轉能量分析
- EMI/SI/PI Diagnostics
 - Stochastic waves 隨機雜訊分析
 - Parasitic resonances 寄生震盪
 - Predominant field sources 主波場根源
 - Standing waves 駐波比
 - Backscattering 后向散射

Circular RMS Power Density 1cm² Area



Maximum Permissible Exposure (5G-MPE) 最大限制暴露值量測

- Power density (W/m²)
 - Directional and Isotropic
 - Averaged over areas of 1cm², 4cm², and 20cm²
- Emitted power
- Reverse energy
- Standing wave ratio

訂購 EM-ISight 與技術洽詢等服務, 請訪問我們網頁或與我全球服務網點連絡:

APREL Lab. Web: www.aprel.com ; www.sglplus.com

中華區代理商: SmartNet Global Limited (TEL: +886-2-26013807 MP: +886-935335713)

APREL 亞洲技術支持中心(Taipei) : MP: +886- 935335713